

## 주사전자현미경(SEM) 워크숍

The 26th Korean Society of Microscopy Scanning Electron Microscopy (SEM, FIB, EPMA) Workshop

주사전자현미경(SEM)은 전자기학 발달에 힘입어 광학현미경의 물리적 한계를 극복하기 위해 탄생했으며, 최근에는 AI 및 자동화 기술과 융합되어 산업 전반의 핵심 분석 장비로 자리 잡고 있습니다.

단순히 표면 형태만 보는 것을 넘어, 원소 분석기(EDS/WDS)를 기본 탑재해 성분 분석을 동시에 진행하며, 현대 나노 기술과 재료 과학의 핵심 도구로 사용되고 있습니다.

이번 교육은 SEM과 FIB 장비 및 EPMA 장비의 원리에 대한 이론 강연뿐 아니라 원소분석(EDS)와 결정방위분석(EBSD)의 핸즈온 실습을 포함하여 구성하였습니다.

이번 워크숍이 SEM 장비에 대한 이해를 높일 뿐 아니라 참가자들의 활발한 교류의 장이 되기를 기대합니다.

일시 | 2026년 7월 14일(화) - 16일(목)

장소 | 부산대학교 제2공학관 2105호

주최 | 한국현미경학회

주관 |



부산대학교 공동실험실습관

세부 일정 |

일자	시작 시간	종료 시간	내용	강사
7월 14일(화)	9:30	10:10	참석자 등록	-
	10:10	10:20	인사말	부산대학교 공동실험실습관장
	10:20	12:00	SEM 원리 I	한국과학기술연구원 김동익
	12:00	13:00	중식	-
	13:00	14:30	SEM 원리 II	럼플리어 김지영
	14:40	16:10	EDS 원리 및 응용	영남대학교 민봉기
	16:20	17:50	EBSD 원리	한국재료연구원 강전연
7월 15일(수)	9:00	11:00	SEM 시료 전처리 및 분석 사례	한국기초과학지원연구원 배태성
	11:00	12:00	X선 분광 분석(WDS) 및 EPMA 응용	경상국립대학교 정종욱
	12:00	13:00	중식	-
	13:00	14:40	FIB 원리 및 응용	나노융합기술원 백경흠
	14:50	15:40	EM 최신 동향	자이스 정은진
	15:50	17:30	EBSD 시료 전처리 및 응용	웨이브센스 강주희
	17:30	18:00	Q&A	-
	18:00	20:00	간담회	-
7월 16일(목)	9:00	10:00	Hands on(EDS)	옥스포드 인스트루먼트 이건용
	10:00	12:00	Hands on(EBSD)	옥스포드 인스트루먼트 이건용
	12:00	13:00	중식	-
	13:00	14:30	실습 I (SEM/FIB/EPMA 중 선택1)	부산대학교 전지영/고민정/이승민
	14:30	16:00	실습 II (SEM/FIB/EPMA 중 선택1)	부산대학교 전지영/고민정/이승민
	16:00	17:00	수료식 및 교육 종료	부산대학교 진미정

**참가대상** | 대학원생을 포함한 SEM, FIB, EPMA 장비의 이용자와  
운영자 혹은 관심 있는 모든 분

**등록안내** | 정원 : 60명(선착순 마감)  
신청 마감 : 2026년 6월 26일(금)까지  
등록비 : 일반 45만원/ 학생 35만원

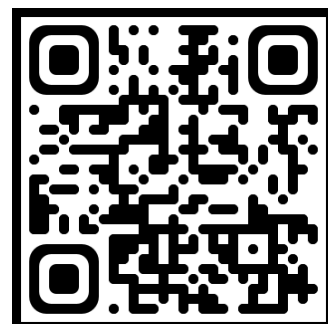
문의 :

부산대학교 진미정

(mjjeen@pusan.ac.kr/051-510-3404)

한국현미경학회

(office@microscopy.or.kr/02-919-8775)



**기타안내** | 한국현미경학회 알림마당 내 공지사항 참고(<https://microscopy.or.kr>)